

はんだ表面の酸化層分析

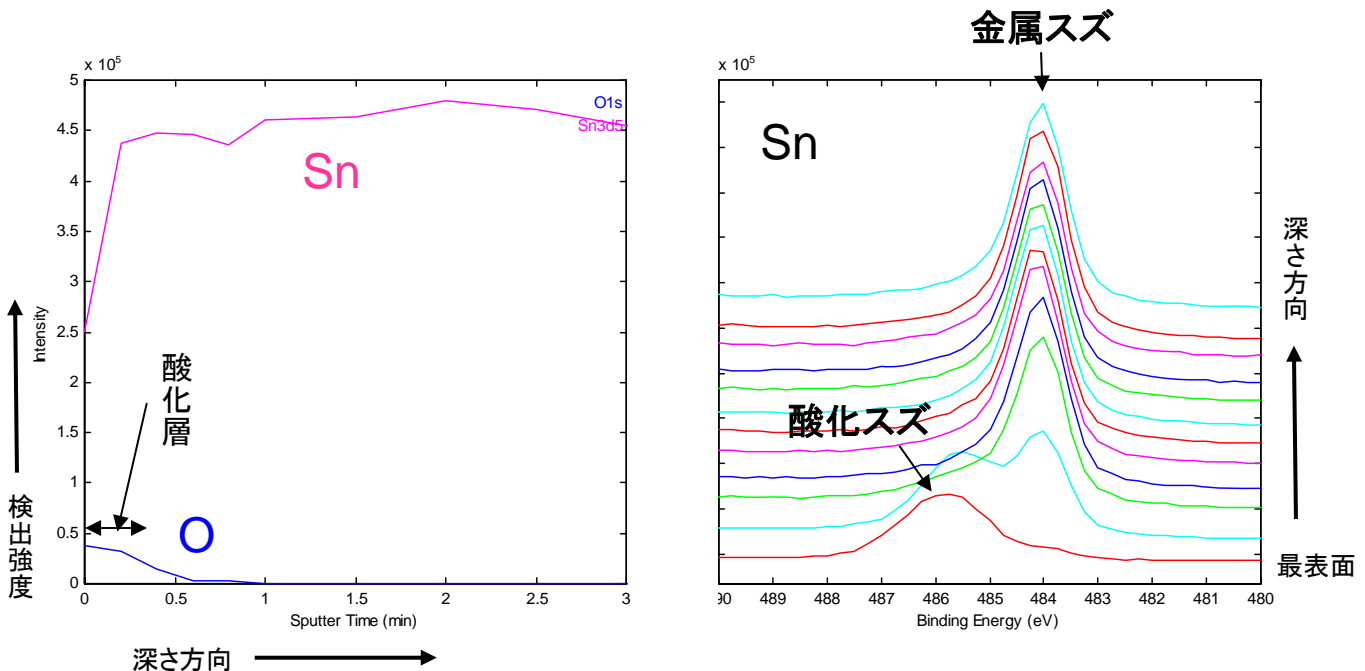


<分析手法> XPS(光電子分光分析法)

ICはんだボールの表面における酸化膜の有無を調べるため、X線光電子分光法(XPS)による深さ方向(状態)の分析を行いました。

<結果>

測定結果において、はんだボール表面に酸化層の存在が認められました。深さ方向分析結果から見積もると、酸化層厚みは2nm未満であることが分かりました。



XPSによる深さ方向分析結果

* アルゴンイオンでエッチングしながら分析